

書籍のご案内

磁粉探傷試験Ⅱ

編集：(社)日本非破壊検査協会

編集委員長 加藤 光昭

体裁：B5版，152頁

定価：本体3,239円＋税（送料別）

磁粉探傷試験は、強磁性体の表面又は表面近傍に存在するきずを検出する方法として優れた能力をもつ試験法であり、重要な機器、構造物及び溶接部などの検査に広く利用されています。磁粉探傷試験には試験対象物及び目的に応じて種々な方法が適用されているため、それらの方法の原理を理解するとともに、試験方法にも熟達して間違いのない試験を実施する必要があります。

本書は、“非破壊検査技術シリーズ 磁粉探傷試験Ⅰ”で習得していただいた基礎知識及び基本的な探傷技術を踏まえて、磁粉探傷試験の理論及びより広い範囲の知識を習得しようとする方を対象として、1989年に“非破壊検査技術シリーズ 磁粉探傷試験Ⅱ”として初版が刊行されました。その後、見直しを適宜行ってきました。今回は、JIS Z 2305:2001 “非破壊試験-技術者の資格及び認証”に基づく認証が2003年から開始されたことに対応するため、見直しを行い、改訂版として刊行しました。

また、JIS G 05605が改定され、JIS Z 2320として制定された（JIS G 0565は廃止されました）ため、必要な箇所はこれらの内容に準じて書き換えをしました。

以下に目次を示す。

- 1 磁粉探傷試験に必要な基礎知識
- 2 磁粉探傷試験
- 3 各種磁化方法とその特徴
- 4 磁気測定
- 5 磁粉探傷試験装置と試験材料
- 6 探傷装置及び材料の管理と安全衛生
- 7 磁粉探傷試験の実際
- 8 仕様書・手順書及び指示書

以上

